

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60749-6

Première édition
First edition
2002-04

**Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –**

**Partie 6:
Stockage à haute température**

**Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –**

**Part 6:
Storage at high temperature**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60749-6:2002